

عنوان مقاله:

تهیه و مشخصه یابی لایه های نازک تیتانات باریم

محل انتشار:

نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی (سال: 1387)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

روح الله عشیری - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد- دانشگاه صنعتی شریف

زیارتعلی نعمتی - عضو هیئت علمی {دانشیار} دانشکده مهندسی و علم مواد- دانشگاه صنعتی شریف

مرتضی ساسانی قمصری - عضو هیئت علمی {دانشجوی دکتری} - گروه اپتیک و اسپکتروسکوپی- پژوهشکده لیزر و

خلاصه مقاله:

لایه های نازک با تیتانات باریم به علت داشتن خواص دی الکتریک مطلوب رفتار فروالکتریک و پیرو الکتریک مطلوب و خواص نوری کاربردهای فراوانی در خازن های چند لایه سنسورها و لایه های نازک نوری دارند. از روش سل_ژل و تکنیک غوطه وری زیرلایه شیشه ای در سل برای تهیه لایه های نازک استفاده شد. از طیف سنجی FT-IR برای بررسی سل و UV-Vis در محدوده طول موجهای 300-1200 نانومتری برای بررسی خواص نوری لایه نازک و از میکروسکوپ afm برای بررسی مورفولوژی سطحی لایه نازک استفاده شد. بررسی های نشان داد لایه های نازک تهیه شده دارای کیفیت سطحی مطلوب میباشند.

کلمات کلیدی:

لایه نازک . تیتانات باریم

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/79514>

